

07 июня 2022 г.

## Открытие конференции

10.30-10.40  
(10 мин.)**К.И. Таперо** – Председатель Программного комитета  
АО «НИИП»**А.В. Яненко** – Зам. председателя Программного комитета  
АО «ЭНПО СПЭЛС»

## Устные доклады

1. 10.40-11.00  
(20 мин.)**А.В. Согоян<sup>1,2</sup>, А.И. Чумаков<sup>1,2</sup>, А.В. Уланова<sup>1,2</sup>,  
Д.В. Бойченко<sup>1,2</sup>, В.Ф. Герасимов<sup>3</sup>**<sup>1</sup>НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФМетоды оценки соответствия изделий ЭКБ требованиям  
радиационной стойкости: проблемы и перспективы2. 11.05-11.20  
(15 мин.)**Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов****Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»**Особенности задания требований по стойкости ЭКБ  
для космических применений к воздействию ИИ КП  
по одиночным радиационным эффектам3. 11.25-11.40  
(15 мин.)**Д.К. Котов<sup>1</sup>, И.О. Васильев<sup>2</sup>, А.В. Грунин<sup>3</sup>**<sup>1</sup>АО «НИИП», <sup>2</sup>ФГУП «ВНИИА», <sup>3</sup>ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»Основные направления развития метрологического  
сопровождения испытаний при создании моделирующих  
установок в рамках МРЦРИ и возможности применения новых  
методов моделирования воздействия радиационных факторов4. 11.45-12.00  
(15 мин.)**А.И. Чумаков<sup>1,2</sup>, Д.В. Бобровский<sup>1,2</sup>, А.В. Согоян<sup>1,2</sup>,  
Н.В. Гаранюшкин<sup>3</sup>, С.Ю. Дианков<sup>4</sup>, В.Ф. Герасимов<sup>4</sup>,  
К.А. Чумаков<sup>2,5</sup>, О.А. Герасимчук<sup>1</sup>, Д.И. Юрков<sup>1</sup>**<sup>1</sup>НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>ФГКУ «12 ЦНИИ» МО РФ,  
<sup>4</sup>ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ, <sup>5</sup>ФГУ ФНЦ НИИСИ РАНОценка уровней сбоев в ИС при нейтронном воздействии разной  
интенсивности12.05-12.15  
(10 мин.)**Обзор постерной сессии****12.15-13.00 Перерыв (кофе-брейк)****13.00-14.00 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ**

5. 14.00-14.15 (15 мин.) **Р.Г. Усеинов**  
 АО «НИИП»  
 Методики измерения сечений SEU от прямой ионизации протонами в субмикронных ИС (обзор)
6. 14.15-14.30 (15 мин.) **А.С. Петров, М.В. Баньковский, В.В. Емельянов, И.А. Алексеев, А.И. Абрамов**  
 АО «НИИП»  
 Возможности импульсных ускорителей электронов АО «НИИП» для моделирования эффектов мощности дозы в широком диапазоне длительностей импульсов
7. 14.30-14.45 (15 мин.) **А.Б. Каракозов, В.А. Марфин, К.А. Москаленко**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Исследование вероятности сбоя цифровых сложно-функциональных микросхем при импульсном ионизирующем воздействии
8. 14.45-15.00 (15 мин.) **Н.А. Усачев, Д.И. Сотсков, Н.М. Жидков, И.А. Данилов, А.Г. Кузнецов, В.В. Елесин**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Цифровые модели ЭКБ для радиоэлектронной аппаратуры доверенного назначения

### 15.00-15.30 Перерыв (кофе-брейк)

9. 15.30-15.45 (15 мин.) **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**  
 Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
 Обеспечение стойкости аппаратуры к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам за счет взаимного экранирования ЭКБ и приборов
10. 15.45-16.00 (15 мин.) **Е.В. Власенков**  
 АО «НПО Лавочкина»  
 Программная реализация методики расчета локальных поглощенных доз и доз структурных повреждений в аппаратуре космических аппаратов с учетом влияния бортовых радиоизотопных источников
11. 16.00-16.15 (15 мин.) **И.В. Елушов**  
 ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»  
 Расчетно-экспериментальный метод оценки сбоеустойчивости КМОП СОЗУ при воздействии потоков нейтронов с энергией до 14 МэВ

12. 16.15-16.30 **И.С. Азанова, Ю.О. Шаронова, Е.А. Пospelова**  
(15 мин.) **ПАО «ПНППК»**  
Сравнение реакции оптического волокна на воздействие импульсных гамма-нейтронного и фотонного излучений
13. 16.30-16.45 **А.Д. Шевцова, И.С. Азанова, А.С. Вахрушев, Ю.О. Шаронова**  
(15 мин.) **ПАО «ПНППК»**  
Радиационная стойкость активного оптического волокна в зависимости от конфигурации суперлюминисцентного волоконного источника

08 июня 2022 г.

14. 10.30-10.45 (15 мин.) **В.В. Калегаев, А.А. Шемухин, М.В. Подзолко, В.О. Барина, В.Е. Еремеев, В.И. Оседло, С.И. Свертилов**  
НИИЯФ МГУ  
Мониторинг и прогнозирование радиационных условий в околоземном космическом пространстве
15. 10.45-11.00 (15 мин.) **А.А. Шемухин, В.И. Шведун, Д.О. Еременко, Н.Г. Чеченин**  
НИИЯФ МГУ  
Ускорительный комплекс МГУ
16. 11.00-11.15 (15 мин.) **Е.В. Мрозовская<sup>1,2</sup>, П.А. Чубунов<sup>1,2</sup>, Г.И. Зебрев<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», <sup>2</sup>НИЯУ МИФИ  
Методика определения максимальной рабочей температуры по тиристорному эффекту при воздействии ТЗЧ
17. 11.15-11.30 (15 мин.) **Е.В. Мрозовская<sup>1,3</sup>, А.М. Галимов<sup>2</sup>, П.А. Чубунов<sup>1,3</sup>, Г.И. Зебрев<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», <sup>2</sup>АО «НИИМА «Прогресс», <sup>3</sup>НИЯУ МИФИ  
Экспериментальное усреднение сечения сбоев по телесному углу как основа для модельно-независимой оценки частоты одиночных сбоев в космосе

## 11.30-12.30 Перерыв (кофе-брейк)

18. 12.30-12.45 (15 мин.) **И.В. Бадурин<sup>1</sup>, М.В. Рябцева<sup>1</sup>, Г.С. Воеводкин<sup>1</sup>, Н.Т. Вагапова<sup>1</sup>, Е.С. Логинова<sup>1</sup>, К.И. Таперо<sup>2</sup>, А.С. Петров<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «НПП «Квант», <sup>2</sup>АО «НИИП»  
Методика оценки радиационной деградации многокаскадных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе полупроводниковой структуры InGaP/InGaAs/Ge
19. 12.45-13.00 (15 мин.) **Г.С. Воеводкин<sup>1</sup>, И.В. Бадурин<sup>1</sup>, М.В. Рябцева<sup>1</sup>, Н.Т. Вагапова<sup>1</sup>, К.И. Таперо<sup>2</sup>, А.С. Петров<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «НПП «Квант», <sup>2</sup>АО «НИИП»  
Фотоинжекционный отжиг радиационных дефектов фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>/Ge
20. 13.00-13.15 (15 мин.) **Н.М. Жидков, Д.И. Сотсков, К.М. Амбуркин, А.Г. Кузнецов, Д.М. Амбуркин, В.В. Елесин, Н.А. Усачев**  
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
Показатели стойкости GaAs функциональных блоков СВЧ приемопередатчиков

21. 13.15-13.30 **А.Н. Егоров, О.Б. Маврицкий, А.А. Печенкин, Д.В. Савченков, М.С. Холина**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Практический опыт использования двухфотонного поглощения лазерного излучения для исследования одиночных эффектов (15 мин.)
22. 13.30-13.45 **А.Г. Петров, И.И. Швецов-Шиловский, С.Б. Шмаков**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Сравнительный анализ стойкости резистивной и других видов энергонезависимой памяти к воздействию ИИ КП (15 мин.)
- 13.45-14.30 Перерыв (кофе-брейк)**
23. 14.30-14.45 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев**  
 Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
 Результаты оценки минимальных уровней стойкости изделий ЭКБ к воздействию ТЗЧ по результатам большого объема испытаний (15 мин.)
24. 14.45-15.00 **А.А. Аникин, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Особенности проведение испытаний на импульсную электрическую прочность в активном электрическом режиме (15 мин.)
25. 15.00-15.15 **М.Г. Березовская, В.П. Шукайло, В.Б. Бычков**  
 ФГУП «РЯЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»  
 Методика измерения поглощенной дозы в кремнии, основанная на аланиновой ЭПР-дозиметрии (15 мин.)
26. 15.15-15.30 **В.М. Зыков, Д.А. Нейман**  
 ИЦ ИШНКБ ТПУ  
 Поверхностно-объемное заряджение неорганических высокоомных диэлектриков электронами средних энергий (15 мин.)
27. 15.30-15.45 **Н.Н. Петух<sup>1</sup>, С.В. Голованов<sup>1</sup>, В.А. Благодырев<sup>1</sup>, П.Б. Лагов<sup>1</sup>, С.А. Яковлев<sup>2</sup>, А.А. Кляйн<sup>2</sup>, П.В. Дорошевич<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «Российские космические системы», <sup>2</sup>Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
 Схемотехническое решение защиты бортовой аппаратуры от воздействия тиристорного эффекта (15 мин.)

### 15.45-16.00

**Дискуссия, обсуждение стендовых докладов  
 Предложения в Решение конференции**

## Стендовые доклады

- С1 Е.Ю. Бахматов, С.В. Вдовин, Д.В. Койнов, Г.Л. Пикалов, С.С. Улькин**  
 ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России  
 Технология испытаний радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию импульсного гамма-излучения
- С2 Т.Ш. Комбаев<sup>1</sup>, М.Е. Артемов<sup>2</sup>, Н.М. Хамидуллина<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал АО «НПО Лавочкина», <sup>2</sup>АО «НПО Лавочкина»  
 Предварительная оценка требований к стойкости по дозовому эффекту используемых в бортовой аппаратуре электрорадиоизделий при полете космического аппарата к Сатурну
- С3 Т.Ш. Комбаев<sup>1</sup>, М.Е. Артемов<sup>2</sup>, Н.М. Хамидуллина<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал АО «НПО Лавочкина», <sup>2</sup>АО «НПО Лавочкина»  
 Оценка эквивалентных потоков и суммарных неионизационных доз на орбитах космических аппаратов типа «Молния»
- С4 Т.Ш. Комбаев<sup>1</sup>, М.Е. Артемов<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал АО «НПО Лавочкина», <sup>2</sup>АО «НПО Лавочкина»  
 Методика проектирования радиационной защиты в средах трехмерного моделирования
- С5 А.Е. Лебединская, Д.А. Смирнов, В.В. Бибикова, Ю.А. Кабальнов, А.Н. Труфанов**  
 Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова  
 Исследование эффектов старения иммерсионных сред оптронов, стойких к воздействию ионизирующего излучения
- С6 Т.А. Шоболова<sup>1</sup>, С.В. Оболенский<sup>1</sup>, Ю.А. Кабальнов<sup>1</sup>, Е.Л. Шоболов<sup>1</sup>, В.В. Гасенин<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова, <sup>2</sup>ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
 Стабилитрон с управляющим контактом на структурах «кремний на изоляторе»
- С7 Э.Н. Вологдин, В.Ф. Синкевич**  
 АО «НПП «Пульсар»  
 Влияние электрического режима полупроводниковых приборов при нейтронном облучении на процессы образования структурных дефектов в кремнии
- С8 Д.О. Ваничкин**  
 АО «НПП «Пульсар»  
 Эффект защёлкивания при испытаниях изделий электронной техники на импульсную электрическую прочность при воздействии одиночного импульса напряжения
- С9 А.Л. Юрьев, С.Л. Эльяш, А.А. Селезнев**  
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
 Модернизированный субнаносекундный ускоритель электронов
- С10 Е.Н. Крылевский, Н.К. Миронов, С.Л. Эльяш, А.Л. Юрьев, Т.И. Полётова, С.С. Есяян, А.А. Селезнев**  
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
 Измерение импульсных характеристик детекторов с наносекундным временным разрешением при воздействии импульсов субнаносекундного ускорителя электронов

- С11 М.В. Анохин<sup>1,2,3</sup>, В.И. Галкин<sup>2</sup>, А.Е. Дубов<sup>1</sup>, О.В. Морозов<sup>2</sup>, Л.В. Савкин<sup>1</sup>, В.В. Сазонов<sup>2</sup>** <sup>1</sup>ИКИ РАН, СКБ КП ИКИ РАН, <sup>2</sup>МГУ им. М.В. Ломоносова, <sup>3</sup>ИТЭТ  
Исследование спектров локальной плотности заряда, образуемого в микроэлектронике в результате ядерных реакций, проходящих в космических аппаратах
- С12 Н.Н. Булгаков, В.Ф. Зинченко**  
АО «Российские космические системы»  
Расчетно-экспериментальная методика оценки области безопасной работы мощных МОП-транзисторов при воздействии тяжелых заряженных частиц космического пространства
- С13 Ю.Н. Бармаков, А.В. Бутин, А.В. Бутина**  
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»  
Применение метода частотного анализа в исследованиях ионизационной реакции диодных структур
- С14 Ю.Н. Бармаков, А.В. Бутин, А.В. Бутина**  
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»  
Методика применения полупроводниковых приборов для оперативной дозиметрии в полях гамма-нейтронного излучения
- С15 И.В. Елушов**  
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»  
Расчетно-экспериментальный метод оценки сбоеустойчивости КМОП СОЗУ при воздействии потоков нейтронов с энергией до 14 МэВ
- С16 А.С. Пилипенко, М.И. Тихонов**  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»  
«Зависание» микроконтроллера при воздействии импульсного ионизирующего излучения
- С17 И.В. Воробьева, С.М. Дубровских, О.В. Ткачев**  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»  
Особенности деградации спектральных характеристик Si- и GaAs-фотодиодов при нейтронном облучении
- С18 Д.А. Амерканов<sup>1</sup>, А.С. Воробьев<sup>1</sup>, А.М. Гагарский<sup>1</sup>, Е.М. Иванов<sup>1</sup>, Г.Ф. Михеев<sup>1</sup>, О.А. Щербаков<sup>1</sup>, А.Е. Козюков<sup>2</sup>, П.А. Чубунов<sup>2</sup>, А.С. Бычков<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, <sup>2</sup>Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
Проект стенда для экспресс-облучения нейтронами и испытаний надежности работы электроники и других устройств авиакосмического назначения
- С19 А.И. Кононенко<sup>1</sup>, А.Г. Циканин<sup>1</sup>, Д.И. Болотина<sup>1</sup>, А.Р. Минасян<sup>2</sup>, Б.В. Мальков<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «НИИП», <sup>2</sup>ОКБ «ГАММА»  
Прогнозирование состояния смещенного кабеля марки КСнг(А)-HF (4×4)+7×(2×0,5) в условиях эксплуатации на АЭС
- С20 А.И. Кононенко, С.В. Белоусов**  
АО «НИИП»  
Применение частотно-резонансной рефлектометрии для диагностирования дефектов в кабелях на АЭС

- C21 **А.В. Наумов**  
АО «НИИП»  
Применение метода восстановленного напряжения для контроля состояния силовых трансформаторов на АЭС
- C22 **А.П. Метелёв**  
АО «НИИП»  
Результаты измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения на борту космического аппарата
- C23 **А.И. Абрамов, И.А. Алексеев, Д.И. Иващенко, А.В. Кириллов, В.В. Кочергин**  
АО «НИИП»  
Методы получения тормозного излучения длительностью 20 нс на ускорителе УИН-10
- C24 **А.И. Абрамов, Д.И. Иващенко, А.В. Кириллов, Т.Б. Мавлюдов**  
АО «НИИП»  
Модернизация диагностической системы установки ЛИУ-10
- C25 **Т.Б. Мавлюдов, Е.В. Тулисов**  
АО «НИИП»  
Исследование режимов формирования электронного пучка в инжекторе ускорителя ЛИУ-10
- C26 **Т.Б. Мавлюдов, Р.С. Плишко, П.В. Москвич**  
АО «НИИП»  
Сравнение характеристик термoluminesцентных детекторов в задачах спектрометрии рентгеновского и гамма-излучения
- C27 **И.В. Бадурин<sup>1</sup>, М.В. Рябцева<sup>1</sup>, Г.С. Воеводкин<sup>1</sup>, Н.Т. Вагапова<sup>1</sup>, Е.С. Логинова<sup>1</sup>, К.И. Таперо<sup>2</sup>, А.С. Петров<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «НПП «Квант», <sup>2</sup>АО «НИИП»  
Методика оценки радиационной деградации многокаскадных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе полупроводниковой структуры InGaP/InGaAs/Ge
- C28 **Г.С. Воеводкин<sup>1</sup>, И.В. Бадурин<sup>1</sup>, М.В. Рябцева<sup>1</sup>, Н.Т. Вагапова<sup>1</sup>, К.И. Таперо<sup>2</sup>, А.С. Петров<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «НПП «Квант», <sup>2</sup>АО «НИИП»  
Фотоинжекционный отжиг радиационных дефектов фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>/Ge
- C29 **А.С. Петров, Е.В. Онойко, И.А. Горбунов**  
АО «НИИП»  
Исследование влияния температуры при гамма-облучении на радиационную стойкость БИКМОП линейных стабилизаторов напряжения
- C30 **А.С. Петров, М.В. Баньковский, В.В. Емельянов, И.А. Алексеев, А.И. Абрамов**  
АО «НИИП»  
Возможности импульсных ускорителей электронов АО «НИИП» для моделирования эффектов мощности дозы в широком диапазоне длительностей импульсов



- C31 **А.А. Шарапов, А.С. Ватуев, В.В. Емельянов**  
АО «НИИП»  
Влияние параметров модели двухфотонного поглощения лазерного излучения на результат оценки чувствительности кремниевых структур к одиночным радиационным эффектам
- C32 **В.В. Емельянов** АО «НИИП»  
Механизм пробоя слоя SiO<sub>2</sub> МОП-структуры при воздействии ТЗЧ
- C33 **Р.Г. Усеинов** АО «НИИП»  
Расчеты интенсивности сфокусированного импульса лазера в Si при двухфотонном поглощении с учетом поглощения на свободных носителях
- C34 **О.В. Мещуров, Р.Г. Усеинов**  
АО «НИИП»  
Оценка погрешности измерения поглощенной дозы МОП-детектором при различных температурах окружающей среды
- C35 **А.А. Козлов, Ю.Ф. Жильникова, А.Д. Шорыгина, А.С. Ватуев, В.В. Емельянов**  
АО «НИИП»  
Экспериментальные исследования одиночных радиационных эффектов на лазерной установке PULSYS-RAD с использованием режима двухфотонного поглощения
- C36 **Б.Н. Семенец, А.А. Козлов, А.В. Бесецкий, А.С. Ватуев, А.Д. Шорыгина, Ю.Ф. Жильникова**  
АО «НИИП»  
Исследование развития тиристорного эффекта в различных структурах полупроводниковых кристаллов интегральных микросхем КМОП-технологии при воздействии импульсного лазерного излучения
- C37 **Д.С. Корытов, А.А. Сафьянов, А.С. Ватуев**  
АО «НИИП»  
Выбор параметров-критериев годности для оценки радиационной стойкости понижающего DC/DC-преобразователя напряжения к воздействию статического низкоинтенсивного гамма-излучения
- C38 **А.С. Ватуев**  
АО «НИИП»  
Оптимизация процедуры определения области безопасной работы мощных полевых транзисторов при воздействии ТЗЧ КП
- C39 **А.И. Озеров**  
АО «НИИП»  
Разработка алгоритма функционального контроля при регистрации одиночных сбоев в статических оперативных запоминающих устройствах
- C40 **А.И. Озеров**  
АО «НИИП»  
Оптимизация быстродействия подсистем обработки и сохранения результатов функционального контроля сложнофункциональных микросхем при радиационных испытаниях

- C41 **А.В. Сиделев** АО «НИИП»  
Оценка предельной чувствительности детекторов ионизирующих излучений на основе МНОП-структур
- C42 **В.Н. Мурашев<sup>1</sup>, К.И. Таперо<sup>2</sup>, С.А. Леготин<sup>1</sup>, А.В. Сиделев<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>НИТУ «МИСиС», <sup>2</sup>АО «НИИП»  
Структура и конструкция монолитного матричного чувствительного элемента для квантовых координатных детекторов ионизирующих излучений
- C43 **В.В. Емельянов, А.В. Сиделев, А.Е. Нестеренко**  
АО «НИИП»  
Радиационный отклик МНОП-структуры на воздействие стационарного гамма-излучения при различной полярности напряжения на затворе
- C44 **А.С. Зуев, Р.Г. Усеинов, А.В. Сиделев**  
АО «НИИП»  
Оценка дефектообразования и ионизационных эффектов в полупроводниковом преобразователе бета-вольтаического источника питания при работе в космическом пространстве
- C45 **И.А. Бусыгина, Ю.С. Лойко, М.А. Бублик, П.В. Москвич, А.В. Кириллов**  
АО «НИИП»  
Подтверждение метрологических характеристик динамических детекторов с длительным сроком эксплуатации
- C46 **П.В. Москвич, В.В. Казаков**  
АО «НИИП»  
К вопросу применения средств измерения характеристик полей фотонного ионизирующего излучения
- C47 **Н.В. Бондаренко, О.В. Косова, М.А. Тюрников, Т.В. Никольская, Н.А. Панкратова, Р.П. Бабак, П.В. Дорошевич**  
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
Особенности подготовки и результаты проведения испытаний DC/DC преобразователей напряжения на стойкость к воздействию ТЗЧ КП
- C48 **Н.В. Бондаренко, О.В. Косова, М.А. Тюрников, А.О. Волков, Н.А. Панкратова, С.А. Яковлев, Р.П. Бабак, П.В. Дорошевич**  
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
Подготовка и проведение испытаний оптопар с вертикальной конфигурацией элементов ионами с энергией более 10 МэВ/нуклон
- C49 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев**  
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
Применение лазерного излучения для уточнения характеристик стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ КП
- C50 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**  
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
Обеспечение стойкости аппаратуры к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам за счет взаимного экранирования ЭКБ и приборов

- C51 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Результаты оценки минимальных уровней стойкости изделий ЭКБ к воздействию ТЗЧ по результатам большого объема испытаний
- C52 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, Н.А. Панкратова, А.О. Волков, П.В. Дорошевич**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Априорная оценка области безопасных электрических режимов МОП-транзисторов при воздействии ТЗЧ по результатам большого объема испытаний
- C53 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Особенности задания требований по стойкости ЭКБ для космических применений к воздействию ИИ КП по одиночным радиационным эффектам
- C54 **А.С. Бакеренков, В.А. Фелицын, П.А. Чубунов, Н.В. Бондаренко, М.С. Мальцева, Н.Г. Ильин, С.А. Яковлев, Р.П. Бабак, П.В. Дорошевич**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Устройство задания и контроля температуры объектов испытаний и практика экспериментальных исследований на стенде Роскосмоса при воздействии ТЗЧ КП
- C55 **М.В. Шеховцов, А.Ю. Рябцева, Р.Р. Хайдаров, С.А. Яковлев, П.В. Дорошевич**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Зависимость количества одиночных сбоев от конфигурации ПЛИС серии XQVR300
- C56 **М.В. Шеховцов, А.Ю. Рябцева, Р.Р. Хайдаров, С.А. Яковлев, П.В. Дорошевич**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Программное скраббирование ПЛИС серии XQVR300 для парирования одиночных сбоев
- C57 **Е.В. Мрозовская<sup>1,2</sup>, П.А. Чубунов<sup>1,2</sup>, Г.И. Зебрев<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», <sup>2</sup>НИЯУ МИФИ*  
 Методика определения максимальной рабочей температуры по тиристорному эффекту при воздействии ТЗЧ
- C58 **Е.В. Мрозовская<sup>1,3</sup>, А.М. Галимов<sup>2</sup>, П.А. Чубунов<sup>1,3</sup>, Г.И. Зебрев<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup>*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», <sup>2</sup>АО «НИИМА «Прогресс», <sup>3</sup>НИЯУ МИФИ*  
 Экспериментальное усреднение сечения сбоев по телесному углу как основа для модельно-независимой оценки частоты одиночных сбоев в космосе
- C59 **Е.Н. Анцупов<sup>1</sup>, П.А. Чубунов<sup>1</sup>, Н.В. Буров<sup>2</sup>, В.И. Сатиков<sup>2</sup>, М.А. Одноблюдов<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup>*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», <sup>2</sup>АО «ЛЛС», <sup>3</sup>ООО «НОРДЛЭЙЗ»*  
 Лазерная пикосекундная испытательная установка с переключаемой длиной волны для воспроизведения одиночных радиационных эффектов
- C60 **Г.А. Протопопов, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**  
*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»*  
 Пересчет показателей стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ для реальных условий эксплуатации

- С61 А.И. Чумаков<sup>1,2</sup>, С.Ю. Дианков<sup>3</sup>, К.А. Чумаков<sup>2,4</sup>, О.А. Герасимчук<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup>НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, <sup>4</sup>ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН  
 Упрощенная оценка чувствительности ИС к эффектам одиночных сбоев при нейтронном воздействии
- С62 А.В. Согоян, А.А. Смолин, А.И. Чумаков, Д.В. Бобровский, Д.О. Титовец, И.И. Швецов-Шиловский**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Угловая зависимость сечения сбоев в СБИС при воздействии протонов и нейтронов
- С63 А.В. Согоян, А.В. Уланова, А.И. Чумаков, Д.В. Бойченко, А.Б. Каракозов, А.Г. Петров, В.Д. Калашников, Д.О. Титовец, Г.Г. Давыдов, А.А. Печенкин, Р.С. Торшин, Г.С. Сорокоумов, И.И.Швецов-Шиловский, Р.И. Гвоздев, Е.В. Волошин, А.Р. Бесчастных, Н.Ю. Сычев, М.М. Ванжа**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Исследование влияния амплитудно-временных характеристик импульсного воздействия на уровни отказов современных СБИС
- С64 М.П. Белова, А.В. Согоян, А.В. Уланова, Д.В. Бойченко, Д.В. Печенкина**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Исследование времени потери работоспособности комплексированных изделий при воздействии импульсного излучения
- С65 А.В. Согоян, А.В. Уланова, А.И. Чумаков, А.А. Смолин, Д.В. Бойченко, Г.Г. Давыдов, В.П. Лукашин, А.А. Печенкин, А.Г. Кузнецов, Д.В. Печенкина, А.С. Колосова, М.В. Музафаров, В.Н. Котов, Н.М. Жидков, С.В. Новиков**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Методы учета эффектов релаксации структурных повреждений при проведении испытаний современных полупроводниковых приборов
- С66 А.А. Печенкин, А.С. Артамонов, А.А. Демидов, А.В. Согоян, Д.В. Бойченко**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Лазерный источник с управляемой формой импульса «ЛИУФИ»
- С67 В.Д. Калашников, А.А. Печенкин, А.А. Демидов, А.Н. Егоров, О.Б. Маврицкий, А.С. Артамонов, А.В. Согоян, А.И. Чумаков**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Лазерно-ускорительный комплекс для исследований импульсной реакции интегральных схем
- С68 А.В. Согоян, И.О. Метёлкин, А.А. Смолин, А.И. Чумаков**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Анализ влияния нелинейных эффектов на уровни возникновения сбоев и отказов в полупроводниковых ИС
- С69 А.В. Согоян**  
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»  
 Метод учета совместного вклада эффектов дозы и мощности дозы в импульсную реакцию приборов

- С70 А.Ю. Никифоров, Д.В. Бойченко, Л.Н. Кессаринский**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Взаимоотношение свойств и понятий радиационной стойкости и доверенности электронной компонентной базы
- С71 Н.М. Жидков, В.Н. Котов, Д.И. Сотсков, Н.А. Усачев, А.Г. Кузнецов, В.В. Елесин**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Апробация методики экстракции параметров СВЧ модели GaAs ГБТ на основе ядра VBiC
- С72 И.А. Данилов, Н.М. Жидков, А.И. Хазанова, Н.А. Усачев, А.В. Зубаков, А.Г. Кузнецов, В.В. Елесин**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Апробация методики восстановления параметров IBIS-моделей цифро-аналоговой ЭКБ доверенных систем
- С73 И.А. Селищев, Д.И. Сотсков, Н.А. Усачев**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
SiGe БикМОП смеситель частот для приемопередающих БИС систем связи пятого поколения
- С74 И.А. Данилов, М.С. Горбунов, А.И. Хазанова, А.Ю. Никифоров**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Радиационно-стойкий температурно-стабильный делитель напряжения на МОП-транзисторах
- С75 Д.И. Сотсков, Н.М. Жидков, А.Г. Кузнецов, В.В. Елесин, Н.А. Усачев**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Радиационные эффекты в 0,18 мкм SiGe БикМОП СВЧ-синтезаторах частот
- С76 И.М. Шеремета, К.М. Амбуркин, А.Г. Кузнецов**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Радиационные эффекты в сложно-функциональных СВЧ приемопередающих модулях
- С77 Д.С. Турбин, К.М. Амбуркин**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Аппаратно-программный комплекс автоматизированного контроля параметров СВЧ квадратурных модуляторов
- С78 Н.В. Шеремета, Д.С. Турбин, К.М. Амбуркин**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Аппаратно-программный стенд контроля вероятности битовых ошибок СВЧ радиоприемных устройств с цифровыми выходами
- С79 Д.С. Костюченко, Д.В. Бобровский, А.А. Печенкин, В.А. Марфин, А.Н. Цирков, А.Б. Каракозов**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Бесконтактная система задания температуры для СБИС с высоким тепловыделением
- С80 А.Н. Шемонаев, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Влияние температуры окружающей среды на показатели импульсной электрической прочности EEPROM ПЗУ 24LC04B

- C81 **М.О. Калашникова, Р.С. Торшин, Г.С. Сорокоумов, А.А. Демидов, Д.В. Бобровский**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Зависимость уровня стойкости SAR-АЦП к воздействию поглощенной дозы от режима облучения
- C82 **Р.Е. Васькин, Г.С. Сорокоумов, Д.В. Бобровский**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Окно функционального сбоя конфигурационных регистров в ЦАП при воздействии импульсного лазерного излучения
- C83 **С.Б. Шамаков**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Оптимизация времени тестирования микросхем EEPROM и FLASH памяти в ходе исследований влияния накопленной дозы на сохранность информации
- C84 **Д.О. Титовец, Г.С. Сорокоумов, А.А. Смолин, Д.В. Бобровский**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Исследование возможности оценки параметров сбоеустойчивости СБИС к нейтронному воздействию с помощью протонного воздействия
- C85 **Г.Г. Давыдов**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
К вопросу об уточнении коэффициента радиационной нагрузки по результатам испытаний
- C86 **В.С. Фигуров**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
К вопросу об оптимизации показателей стойкости изделий электронной техники к воздействию импульсных ионизирующих излучений
- C87 **В.С. Фигуров**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Методика определения вероятностных оценок уровней пороговых сбоев и отказов изделий электронной техники при воздействии импульсных ионизирующих излучений
- C88 **В.С. Фигуров, В.В. Байков**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Требования к аттестации испытательных установок по критерию обеспечения единства и достоверности результатов радиационных испытаний изделий электронной техники
- C89 **О.Ю. Винокуров, Д.В. Печенкина, Н.Л. Петрунь, С.М. Малюченко**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
Влияние схемы включения микросхем на уровень стойкости к воздействию импульсного ионизирующего излучения
- C90 **Ю.М. Московская<sup>1,2</sup>, Л.И. Губаревич<sup>2</sup>, А.В. Поздновский<sup>2</sup>, В.А. Вавилов<sup>3</sup>, А.А. Кармазинова<sup>2</sup>, К.О. Ватутин<sup>2</sup>**  
*<sup>1</sup>НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>АО «Микрон»*  
Манипулирование режимами и параметрами как формальный способ повышения уровня стойкости

- C91 **Д.В. Заворотнов, С.А. Липатников, А.С. Колосова, А.С. Каменева**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Разброс уровней стойкости интегральных датчиков температуры производства фирмы Analog Devices
- C92 **С.М. Малюченко, Д.В. Печенкина**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Контроль и оценка времени потери работоспособности дифференциального усилителя с программируемым коэффициентом усиления
- C93 **А.Р. Бесчастных, А.С. Колосова, Н.Ю. Сычев**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Влияние электрического режима при контроле функционирования на дозовую стойкость микросхем цифровой логики
- C94 **Н.Д. Кравченко, И.О. Лоскутов, П.В. Некрасов, В.А. Марфин, А.В. Яненко**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Исследование причин функциональных сбоев при воздействии отдельных ядерных частиц в микропроцессоре LEON3
- C95 **Е.С. Махинов, А.Ю. Егоров, И.О. Лоскутов, А.В. Яненко, П.В. Некрасов**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Исследование метода программной инъекции для определения сечения функциональных сбоев в микроконтроллере STM32
- C96 **А.Н. Егоров, О.Б. Маврицкий, А.А. Печенкин, Д.В. Савченков, М.С. Холина**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Практический опыт использования двухфотонного поглощения лазерного излучения для исследования одиночных эффектов
- C97 **А.Р. Грицаенко<sup>1,2</sup>, А.А. Печенкин<sup>1,2</sup>, В.В. Бибикова<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup>НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова  
 Сравнительные исследования одиночных сбоев в КМОП КНИ СОЗУ при воздействии лазерного излучения с различными длительностями импульса
- C98 **А.Н. Цирков**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Методика определения времени развития катастрофического отказа в КМОП ИС при возникновении одиночных радиационных эффектов
- C99 **Р.К. Можяев**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Исследование динамики самовосстановления оптоэлектронного приемо-передающего модуля при импульсном и стационарном ионизирующем воздействии
- C100 **Р.К. Можяев, А.А. Печенкин**  
*НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*  
 Исследование электролюминесценции паразитной тиристорной структуры в КМОП СБИС

- C101 **А.С. Ягодкин, В.И. Анциферова, А.В. Полуэктов, М.В. Солодилов, Н.И. Владимирова, Ю.Ю. Бутова, Д.Е. Рыченков**  
*ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*  
 Алгоритмические основы проектирования электронной компонентной базы космического назначения и типизация проектных процедур, определяющими стойкость изделий к низкоинтенсивному ионизирующему излучению космического пространства
- C102 **В.К. Зольников, И.В. Журавлева, К.А. Чубур, И.И. Струков, Е.В. Грошева**  
*ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*  
 Учет радиационного воздействия при проектировании электронной компонентной базы
- C103 **В.К. Зольников, В.В. Суханов, Е.И. Алексинский, О.А. Денисова, С.В. Гречаный**  
*ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*  
 Учет радиации при проектировании электронной компонентной базы на функциональном уровне
- C104 **М.И. Колесников, М.Э. Харченко, В.А. Дорохов, К.В. Зольников, Н.Г. Гамзатов, А.С. Грошев**  
*ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*  
 Электрическая схема испытаний полупроводниковой электроники для экстремальных условий
- C105 **К.В. Сафронов, В.А. Флегентов, С.А. Горохов, Н.Н. Шамаева, А.С. Тищенко, Д.О. Замураев, А.Л. Шамраев, С.Ф. Ковалева, Н.А. Фёдоров, С.М. Дубровских, А.С. Пилипенко, А.С. Кустов, Е.А. Шибиков**  
*ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»*  
 Радиационные эффекты в микроэлектронном устройстве при воздействии протонов лазерного ускорителя
- C106 **Н.Н. Петух<sup>1</sup>, С.В. Голованов<sup>1</sup>, В.А. Благодырев<sup>1</sup>, П.Б. Лагов<sup>1</sup>, С.А. Яковлев<sup>2</sup>, А.А. Кляйн<sup>2</sup>, П.В. Дорошевич<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>АО «Российские космические системы», <sup>2</sup>Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»  
 Схемотехническое решение защиты бортовой аппаратуры от воздействия тиристорного эффекта
- C107 **Е.Н. Некрасова, Е.В. Митин, Д.Е. Мелешкевич, И.С. Журавлев**  
*ООО «НПЦ «Гранат»*  
 Исследование угловой зависимости SEGR и SEB-эффектов в мощных МОП-транзисторах
- C108 **О.В. Лешонков<sup>1</sup>, А.И. Яньков<sup>1</sup>, С.В. Митрофанов<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>ООО «НПП «Детектор», <sup>2</sup>ЛЯР ОИЯИ  
 Испытательный ионный комплекс контроля стойкости ЭКБ при воздействии ТЗЧ КП



## Участники конференции «Стойкость-2022»

Ф.И.О.	Должность	Место работы
1. Абрамов Александр Игоревич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
2. Азанова Ирина Сергеевна	Директор НОЦ - главный конструктор	ПАО «ГНППК» г. Пермь
3. Азовцев Егор Андреевич	Инженер-исследователь – Зам. руководителя группы	ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
4. Айтуганов Олег Геннадьевич	Инженер 2 категории	АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино, МО
5. Алексеев Иван Александрович	Заместитель главного инженера, к.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
6. Амбуркин Константин Михайлович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
7. Амерканов Дмитрий Александрович	Научный сотрудник	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ г. Гатчина
8. Андреянов Денис Александрович	Инженер-исследователь 2 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
9. Аникин Андрей Александрович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
10. Арсентьев Дмитрий Иванович	Инженер	АО «НИИ ТП» г. Москва
11. Артемов Михаил Евгеньевич	Ведущий специалист	АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская обл.
12. Афанасьев Дмитрий Викторович	Заместитель начальника отдела	АО «Российские космические системы» г. Москва
13. Ахметов Алексей Олегович	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
14. Бадурин Илья Владимирович	Инженер-технолог	АО «НПП «КВАНТ» г. Москва
15. Бакеренков Александр Сергеевич	Ведущий научный сотрудник	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
16. Баньковский Максим Владимирович	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
17. Баранова Яна Олеговна	Инженер	АО «НИИЭТ» г. Воронеж
18. Батин Алексей Иванович	Начальник лаборатории	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
19. Бачинский Алексей Владимирович	Руководитель проектов	ООО «Остек-Электро» г. Москва
20. Белова Майя Павловна	Младший научный сотрудник – Зам. руководителя группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
21. Белоусов Сергей Викторович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино

22.	Березовская Мария Григорьевна	Инженер-исследователь	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
23.	Березовский Александр Геннадьевич	Начальник группы	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
24.	Бесецкий Алексей Валерьевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
25.	Бесчастных Аделия Рамильевна	Младший научный сотрудник – Заместитель руководителя группы	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
26.	Бобровский Дмитрий Владимирович	Начальник НТК-2 – главный специалист, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
27.	Боглаенков Владимир Константинович	Заместитель начальника отдела	ПАО НПО «Наука» г. Москва
28.	Бойченко Дмитрий Владимирович	Генеральный директор, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
29.	Бондаренко Николай Владимирович	Начальник группы	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
30.	Борисов Юрий Анатольевич	Главный специалист	АО «Газпром космические системы» г. Щелково, МО
31.	Борудина Анна Борисовна	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
32.	Булкин Вадим Валентинович	Начальник установки РИУС-5	АО «НИИП» г. Лыткарино
33.	Бусыгина Ирина Алексеевна	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
34.	Бутин Алексей Валентинович	Инженер	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
35.	Бутин Иван Валентинович	Инженер	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
36.	Ваничкин Денис Олегович	Инженер	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
37.	Васькин Роман Евгеньевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
38.	Ватуев Александр Сергеевич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
39.	Винокуров Олег Юрьевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
40.	Внукова Евгения Юрьевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
41.	Власенков Евгений Викторович	Ведущий конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская обл.
42.	Воеводкин Георгий Сергеевич	Младший научный сотрудник	АО «НПП «КВАНТ» г. Москва
43.	Вологдин Эрих Николаевич	Старший научный сотрудник	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
44.	Галимов Артур Маратович	Начальник группы	АО «НИИМА «Прогресс» г. Москва

45.	Гвоздев Роман Игоревич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
46.	Герасимов Владимир Фёдорович	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
47.	Героев Алексей Владимирович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
48.	Гирко Александр Брониславович	Начальник установки ЛИУ-10	АО «НИИП» г. Лыткарино
49.	Голованов Степан Валерьевич	Инженер-исследователь 2 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
50.	Голубцов Артем Александрович	Инженер-исследователь 1 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
51.	Горбунов Максим Сергеевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
52.	Горелов Андрей Александрович	Заместитель начальника отдела- начальник лаборатории	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
53.	Григорьева Александра Владимировна	Инженер-конструктор 1 категории	АО «СКТБ ЭС» г. Воронеж
54.	Громов Дмитрий Викторович	Главный научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
55.	Губаревич Леонид Игоревич	Ведущий инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
56.	Гусаров Евгений Владимирович	Инженер	АО «НИИЭТ» г. Воронеж
57.	Давыдов Георгий Георгиевич	Ведущий научный сотрудник – Заместитель начальника НТК	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
58.	Данилов Игорь Александрович	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
59.	Дементьев Дмитрий Владимирович	Научный сотрудник	ОИЯИ г. Дубна
60.	Деревянко Юрий Борисович	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
61.	Дидык Павел Игоревич	Начальник участка	АО «Российские космические системы» г. Москва
62.	Дорошевич Павел Викторович	Советник	АО «НИИП» г. Лыткарино
63.	Дренин Андрей Сергеевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва
64.	Дрокин Артём Алексеевич	Старший инженер-испытатель	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
65.	Дубровских Сергей Михайлович	Научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
66.	Егоров Алексей Юрьевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

67.	Елесин Вадим Владимирович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
68.	Елушов Илья Владимирович	Научный сотрудник	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
69.	Емельянов Владимир Владимирович	Советник	АО «НИИП» г. Лыткарино
70.	Епифанцев Константин Алексеевич	Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
71.	Жамалетдинов Марат Надирович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
72.	Жидков Никита Михайлович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
73.	Жильникова Юлия Федоровна	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
74.	Жуков Михаил Викторович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
75.	Завирова Виктория Викторовна	Инженер-конструктор 2 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
76.	Заворотнов Дмитрий Владимирович	Инженер-исследователь – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
77.	Земцов Артем Эдуардович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
78.	Зинченко Владимир Фёдорович	Ведущий научный сотрудник	АО «Российские космические системы» г. Москва
79.	Зольников Владимир Константинович	Главный научный сотрудник	АО «НИИЭТ» г. Воронеж
80.	Зуев Алексей Сергеевич	Младший научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
81.	Иванов Леонид Николаевич	Заместитель директора НТЦ	АО «ГК «Электронинвест» г. Москва
82.	Иванова Виктория Анатольевна	Научный сотрудник	АО «ЦНИИмаш» г. Королев Московской обл.
83.	Иванова Наталья Викторовна	Техник 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино
84.	Иващенко Дмитрий Михайлович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
85.	Игнатенко Михаил Александрович	Инженер-конструктор	АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
86.	Кабальнов Юрий Аркадьевич	Ведущий научный сотрудник	Филиал ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
87.	Казанцев Дмитрий Алексеевич	Заместитель начальника отдела	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
88.	Калашников Владислав Дмитриевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

89.	Калашникова Мария Олеговна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
90.	Капшуков Алексей Федорович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
91.	Каракозов Андрей Борисович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
92.	Карпухин Владимир Михайлович	Ведущий инженер	АО «ПНИЭИ» г. Пенза
93.	Кириллов Алексей Владимирович	Начальник управления ускорителей	АО «НИИП» г. Лыткарино
94.	Козлов Артем Александрович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
95.	Козюков Александр Евгеньевич	Советник	АО «НИИП» г. Лыткарино
96.	Колабушкин Сергей	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
97.	Колосова Анна Сергеевна	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
98.	Комбаев Тимур Шикиурович	Ведущий конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская обл.
99.	Кононенко Александр Иванович	Начальник управления	АО «НИИП» г. Лыткарино
100.	Копылов Валерий Андреевич	Заместитель начальника отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
101.	Косова Ольга Владимировна	Инженер-исследователь 3 категории	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
102.	Костерин Михаил Иванович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
103.	Котляр Илья Владимирович	Инженер КМК 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино
104.	Котов Владислав Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
105.	Котов Дмитрий Константинович	Заместитель генерального директора по качеству и метрологии	АО «НИИП» г. Лыткарино
106.	Кочергин Владимир Васильевич	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
107.	Кравченко Николай Дмитриевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
108.	Краснов Андрей Александрович	Начальник отдела	АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
109.	Кузнецов Александр Геннадьевич	Научный сотрудник – Заместитель начальника НТК-1	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
110.	Кузнецов Виталий Андреевич	Инженер-исследователь 3 категории	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров

111.	Кузьмин Иван Олегович	Инженер 2 категории	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
112.	Лагов Петр Борисович	Начальник отдела	АО «Российские космические системы» г. Москва
113.	Лалаев Сергей Алексеевич	Инженер 2 категории	АО «НИИ ТП» г. Москва
114.	Лебедев Александр Николаевич	Ведущий инженер	АО «СКТБ ЭС» г. Воронеж
115.	Леонтьев Лев Иванович	Начальник Бюро надежности	АО «АВЭКС» г. Москва
116.	Лешонков Олег Владимирович	Ведущий инженер	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
117.	Липатников Сергей Алексеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
118.	Липский Алексей Константинович	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
119.	Литвицкий Константин Владимирович	Ведущий инженер	НПП «ОПТЭКС» - филиал АО «РКЦ «Прогресс» г. Москва г. Зеленоград
120.	Лойко Юрий Сергеевич	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
121.	Лоскутов Илья Олегович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
122.	Луконин Станислав Евгеньевич	И.о. заведующего ЛРИМИ ИЦ ТПУ	ИЦ ИШНКБ ТПУ г. Томск
123.	Лучкина Мария Емельяновна	Научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
124.	Лысина Екатерина Александровна	Инженер-исследователь 2 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
125.	Мавлюдов Тимур Булатович	Инженер по КИПиА	АО «НИИП» г. Лыткарино
126.	Макаров Ярослав Олегович	Инженер-электроник	АО «НИИ «Субмикрон» г. Зеленоград
127.	Малюченко Сергей Михайлович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
128.	Маркович Никита Иванович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
129.	Марфин Владимир Александрович	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
130.	Марченко Владимир Александрович	Ведущий специалист	АО «НПЦАП» г. Москва
131.	Махиня Алексей Николаевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
132.	Медведев Илья Вадимович	Инженер-механик 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино

133.	Меркин Михаил Моисеевич	Заместитель директора	НИИЯФ МГУ г. Москва
134.	Метелёв Александр Павлович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
135.	Мещуров Олег Викторович	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
136.	Мионов Иван Алексеевич	Инженер	АО «НПЦАП» г. Москва
137.	Митин Евгений Викторович	Начальник отдела	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
138.	Михалева Любовь Николаевна	Ведущий инженер	ПАО «НПО «Алмаз» г. Москва
139.	Морозов Иван Сергеевич	Ведущий специалист	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
140.	Москаленко Кирилл Андреевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
141.	Москвич Петр Владимирович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
142.	Мрозовская Елизавета Владимировна	Инженер-исследователь 2 категории	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
143.	Мурзин Вадим Юрьевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва
144.	Музафаров Михаил Валентинович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
145.	Мурзов Борис Петрович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
146.	Мурыгин Артем Владимирович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
147.	Назаренко Антон Александрович	Начальник группы	АО «ИСС» г. Железногорск
148.	Насеткин Константин Александрович	Инженер-программист 2 категории	АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург
149.	Нейман Дмитрий Александрович	Инженер ЛИРЭ ИЦ ТПУ	ИЦ ИШНКБ ТПУ г. Томск
150.	Некрасова Екатерина Николаевна	Старший инженер испытательной лаборатории	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
151.	Нестеренко Александр Евгеньевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
152.	Никоноров Виталий Валериевич	Инженер 2 категории	АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург
153.	Овчинникова Светлана Александровна	Научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
154.	Озеров Александр Иванович	Начальник управления радиационных испытаний	АО «НИИП» г. Лыткарино
155.	Онойко Евгений Викторович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино

156.	Павленко Иван Александрович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
157.	Павлов Владимир Александрович	Начальник отдела	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
158.	Павлов Николай Александрович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
159.	Петров Александр Сергеевич	Начальник отдела, к.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
160.	Петров Михаил Сергеевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
161.	Петров Андрей Григорьевич	Ведущий научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
162.	Петров Анатолий Иванович	Заместитель начальника отдела	АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино, МО
163.	Петух Николай Николаевич	Ведущий инженер-исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
164.	Печенкин Александр Александрович	Начальник НТК-4 - главный специалист	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
165.	Печенкина Дарья Витальевна	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
166.	Пилипенко Анатолий Сергеевич	Старший научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина» г. Снежинск
167.	Плишко Роман Станиславович	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
168.	Поздновский Алексей Валерьевич	Ведущий инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
169.	Полевич Станислав Анатольевич	Ведущий инженер-технолог	АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино, МО
170.	Поляков Яков Игоревич	Руководитель бюро по сертификации ЭКБ	АО «ИТЦ-НПО ПМ» г. Железногорск
171.	Посысаев Евгений Иванович	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
172.	Примак Михаил Александрович	Начальник участка специпытаний СККР	АО «НЗПП Восток» г. Новосибирск
173.	Протопопов Григорий Александрович	Ведущий научный сотрудник	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
174.	Прыгунов Егор Викторович	Руководитель группы СВФ сектора СФ	ООО «ИРЗ ТЕСТ» г. Ижевск
175.	Роговая Мария	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
176.	Руденков Андрей Евгеньевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
177.	Савинов Денис Юрьевич	Начальник установки УИН-10П	АО «НИИП» г. Лыткарино



178. Сапожников Вячеслав Анатольевич	Инженер- испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
179. Сафьянов Алексей Анатольевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
180. Сиделев Алексей Владимирович	Начальник отдела научной и инновационной деятельности	АО «НИИП» г. Лыткарино
181. Скоробогатов Михаил Анатольевич	Начальник отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
182. Смолин Анатолий Александрович	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
183. Согоян Армен Вагоевич	Ведущий научный сотрудник	ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
184. Сорокоумов Георгий Сергеевич	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
185. Сотсков Денис Иванович	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
186. Столярук Егор Валериевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
187. Сычев Николай Юрьевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
188. Таперо Константин Иванович	Заместитель генерального директора по науке и инновациям, д.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
189. Тарараксин Александр Сергеевич	Научный сотрудник – Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
190. Телец Виталий Арсеньевич	Директор	ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
191. Теплякова Анастасия	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
192. Титовец Дмитрий Олегович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
193. Токарев Владимир Евгеньевич	Инженер-исследователь 1 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
194. Торшин Роман Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
195. Тулисов Евгений Викторович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
196. Уланова Анастасия Владиславовна	Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
197. Уланова Светлана Михайловна	Инженер 1 категории	АО «УПКБ «Деталь» г. Каменск-Уральский
198. Усачев Николай Александрович	Начальник НТК-1, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
199. Усеинов Рустэм Галеевич	Ведущий научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино

200.	Усманов Евгений Халилович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
201.	Фёдоров Андрей Алексеевич	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
202.	Фелицын Владислав Александрович	Научный сотрудник	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
203.	Фигуров Валерий Сергеевич	Ведущий инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
204.	Филатов Сергей Анатольевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
205.	Филимонов Александр Владимирович	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
206.	Хайдаров Руслан Рашидович	Инженер-исследователь 2 категории	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
207.	Хамидуллина Наталья Мугалимовна	Главный конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская обл.
208.	Хуснутдинов Мансур Наилевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
209.	Циканин Александр Геннадьевич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
210.	Чубунов Павел Александрович	Начальник НПК	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
211.	Чуков Георгий Викторович	Начальник НТК-3 - главный специалист	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
212.	Чумаков Александр Иннокентьевич	Главный научный сотрудник – главный эксперт	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
213.	Чумаков Константин Александрович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
214.	Шакуров Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела-начальник лаборатории	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
215.	Шаронова Юлия Олеговна	Начальник лаборатории	ПАО «ПНППК» г. Пермь
216.	Швецов-Шиловский Иван Иванович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
217.	Шевцова Анастасия Денисовна	Инженер-исследователь	ПАО «ПНППК» г. Пермь
218.	Шелковников Виктор Васильевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
219.	Шемонаев Александр Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
220.	Шемухин Андрей Александрович	Заместитель директора	НИИЯФ МГУ г. Москва
221.	Шеремета Ирина Михайловна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

<b>222.</b> Шеремета Никита Владимирович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
<b>223.</b> Шмаков Сергей Борисович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС»/ ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
<b>224.</b> Эльяш Света Львовна	Ведущий научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
<b>225.</b> Яковлев Сергей Александрович	Начальник отдела	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
<b>226.</b> Яковлева Любовь Дмитриевна	Инженер 1 категории	АО «ИТЦ-НПО ПМ» г. Железногорск
<b>227.</b> Яненко Андрей Викторович	Технический директор, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
<b>228.</b> Яньков Андрей Ильич	Технический директор	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна

